

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
- (B) An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) An Vorsitzende
- (D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. März 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0915/06 - 3.4.01

Anmeldenummer: 00964256.2

Veröffentlichungsnummer: 1242827

IPC: G01R 1/073

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zum Testen von Leiterplatten

Anmelder:

atg Luther & Maelzer GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 84, 113

Schlagwort:

"Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0915/06 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 13. März 2009

Beschwerdeführer: atg Luther & Maelzer GmbH
Zum Schlag 3
D-97877 Wertheim/Reicholzheim (DE)

Vertreter: Ganahl, Bernhard
Huber & Schüssler
Patentanwälte
Truderinger Strasse 246
D-81825 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 19. Januar
2006 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 00964256.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Assi
Mitglieder: F. Neumann
D. S. Rogers

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 19. Januar 2006 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung zurückzuweisen.
- II. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patentes auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem Hauptantrag, eingereicht mit Schreiben vom 12. Februar 2009, hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit dem selben Schreiben, zu erteilen.

Darüber hinaus wurde hilfsweise ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

Mit Telefax vom 12. März 2009 kündigte der Vertreter des Beschwerdeführers an, dass er nicht an der am 13. März 2009 anberaumten mündlichen Verhandlung teilnehmen würde. Es wurde gebeten nach Aktenlage zu entscheiden.

- III. Die mündliche Verhandlung fand in Abwesenheit des Vertreters des Beschwerdeführers statt.
- IV. Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"Verfahren zum Testen von Leiterplatten mittels eines Paralleltesters, der eine Kontaktanordnung mit mehreren Testkontakten (8) zum gleichzeitigen Kontaktieren mehrerer Leiterplattentestpunkte (4) einer zu testenden Leiterplatte (5) aufweist, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

- *Auflegen einer zu testenden Leiterplatte (5) auf die Kontaktanordnung, so daß zumindest Leiterplattentestpunkte (4) eines ersten Bereichs einer zu testenden Leiterplatte (5) mit Testkontakten (8) eines ersten Bereichs der Kontaktanordnung in Kontakt stehen,*
- *Durchführen eines ersten Testmeßvorgangs in diesem ersten Bereich,*
- *Verschieben der zu testenden Leiterplatte (5) bzgl. der Kontaktanordnung um einen vorbestimmten Verschiebeweg, so daß zumindest Leiterplattentestpunkte (4) eines zweiten Bereichs der zu testenden Leiterplatte (5) mit Testkontakten (8) eines zweiten Bereichs der Kontaktanordnung in Kontakt stehen, sich der erste und zweite Bereich überlappen, wobei alle Leiterbahnen (13b), die Leiterplattentestpunkte des ersten und des zweiten Bereichs der zu testenden Leiterplatte (5) verbinden, einen Leiterplattentestpunkt in diesem überlappenden Abschnitt aufweisen, und*
- *Durchführen eines zweiten Testmeßvorgangs in diesem zweiten Bereich."*

Anspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** lautet wie folgt:

"Verfahren zum Testen von Leiterplatten mittels eines Paralleltesters, der eine Kontaktanordnung mit mehreren Testkontakten (8) zum gleichzeitigen Kontaktieren mehrerer Leiterplattentestpunkte (4) einer zu testenden Leiterplatte (5) aufweist, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

- *Festlegen von überlappenden Bereichen der Leiterplatte (5), so daß alle Leiterbahnen (13b), die sich zumindest über zwei Bereiche erstrecken, einen*

Leiterplattentestpunkt (4) in dem überlappenden Abschnitt der sich überlappenden Bereiche aufweisen,

- Auflegen einer zu testenden Leiterplatte (5) auf die Kontaktanordnung, so daß zumindest Leiterplattentestpunkte (4) eines ersten Bereichs einer zu testenden Leiterplatte (5) mit Testkontakten (8) eines ersten Bereichs der Kontaktanordnung fehlerfrei in Kontakt stehen,*
- Durchführen eines ersten Testmeßvorgangs in diesem ersten Bereich,*
- Verschieben der zu testenden Leiterplatte (5) bzgl. der Kontaktanordnung um einen vorbestimmten Verschiebeweg, so daß zumindest Leiterplattentestpunkte (4) eines zweiten Bereichs der zu testenden Leiterplatte (5) mit Testkontakten (8) eines zweiten Bereichs der Kontaktanordnung fehlerfrei in Kontakt stehen,*
- Durchführen eines zweiten Testmeßvorgangs in diesem zweiten Bereich, und*
- Wiederholen des Verschiebevorganges und des Testmessvorganges zum Testen weiterer Bereiche, falls weitere Bereiche festgelegt worden sind, bis die Leiterplatte in allen Bereichen getestet ist."*

Anspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** ist gegenüber Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags durch folgende Schritte ergänzt worden:

"- Ermitteln der Abweichungen der Leiterplattentestpunkte (4) der zu testenden Leiterplatte von ihren Soll-Positionen,

- Optimieren der Bereiche der zu testenden Leiterplatte auf Grundlage der ermittelten Abweichungen und auf Grundlage von Leiterplattendaten dahingehend, dass jeweils möglichst viele Leiterbahnen und/oder möglichst*

viele Leiterplattentestpunkte mit der Kontaktanordnung in Kontakt stehen,".

Diese zusätzlichen Schritte sind zwischen den Schritten "- Festlegen" und "- Auflegen..." eingeführt worden.

Anspruch 1 des **dritten Hilfsantrags** basiert auf Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags, jedoch lautet der einleitende Teil des Anspruchs nun *"Verfahren zum Testen von Leiterplatten mittels eines Paralleltesters, der eine Kontaktanordnung mit mehreren Testkontakten (8) zum gleichzeitigen Kontaktieren mehrerer Leiterplattentestpunkte (4) einer zu testenden Leiterplatte (5) aufweist, wobei die Testkontakte (8) exakt in dem Muster der Leiterplattentestpunkte (4) einer idealen zu testenden Leiterplatte (5) angeordnet sind, und das Verfahren folgende Schritte umfaßt:"*

Anspruch 1 des **vierten Hilfsantrags** ist gegenüber Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags ergänzt worden, indem die zusätzliche Erklärung *"wobei die in überlappenden Abschnitten zweier Bereiche angeordneten Leiterplattentestpunkte von Leiterbahnen, die Leiterplattentestpunkte zweier Bereiche der zu testenden Leiterplatte verbinden, während der Testmeßvorgänge der jeweiligen Bereiche mit der Kontaktanordnung in Kontakt stehen."* am Ende von Anspruch 1 eingeführt worden ist.

- V. Die Argumente des Beschwerdeführers, soweit sie für die Entscheidung relevant sind, werden in den Entscheidungsgründen wiedergegeben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Gültige Version der Beschreibung

Der Beschwerdeführer gab an, dass die mit Schreiben vom 12. Februar 2009 eingereichten Anträge "alle bisherigen Anträge" ersetzen. Die bisherigen Anträge enthielten sowohl Ansprüche als auch Beschreibungsseiten. Da jedoch keine neuen Beschreibungsseiten mit dem Schreiben vom 12. Februar 2009 eingereicht wurden, muss davon ausgegangen werden, dass die Erteilung auf der Grundlage von den Ansprüchen der verschiedenen Anträge mit jeweils der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht beantragt wird.

3. Hauptantrag:

3.1 Anspruch 1 ist nicht von der Beschreibung gestützt (Artikel 84 EPÜ 1973).

3.2 Das in der Beschreibung erklärte Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Testen von Leiterplatten mittels eines Paralleltesters zu schaffen, das es erlaubt, selbst großflächige Leiterplatten mit einem Verzug und/oder einem Versatz **vollständig** und korrekt mit der Kontaktanordnung des Paralleltesters zu kontaktieren (Seite 5, Zeilen 19-22). Aus der Beschreibung geht hervor, dass dieses Ziel dadurch erreicht wird, dass während eines Messvorgangs die Leiterplattentestpunkte eines ersten zu testenden Prüfbereichs der Leiterplatte mit den entsprechenden Testkontakten der Kontaktanordnung fehlerfrei in Kontakt stehen. Hierbei

können alle Leiterbahnen und die Leiterbahnabschnitte, die vollständig in dem ersten Prüfbereich liegen, getestet werden (Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 18; Fig. 3). Der Messvorgang wird dann für einen zweiten Prüfbereich wiederholt, wobei sich der erste und der zweite Prüfbereich überlappen. Folglich besteht ein wesentliches Merkmal der Erfindung darin, dass **alle** Leiterplattentestpunkte eines Prüfbereichs während des entsprechenden Testmessvorgangs mit der Kontaktanordnung in Kontakt stehen.

- 3.3 Anspruch 1 definiert, dass "zumindest Leiterplattentestpunkte (4) eines ersten Bereiches einer zu testenden Leiterplatte (5) mit Testkontakten (8) eines ersten Bereichs der Kontaktanordnung in Kontakt stehen" und dass "zumindest Leiterplattentestpunkte (4) eines zweiten Bereiches der zu testenden Leiterplatte (5) mit Testkontakten (8) eines zweiten Bereichs der Kontaktanordnung in Kontakt stehen". Dieser Wortlaut kann so ausgelegt werden, dass lediglich **einige** Leiterplattentestpunkte des ersten bzw. zweiten Bereiches mit den entsprechenden Testkontakten der Kontaktanordnung in Kontakt stehen. Somit schließt der Wortlaut nicht aus, dass der erste bzw. zweite Bereich Leiterplattentestpunkte beinhalten kann, außer denjenigen, die mit der Kontaktanordnung während des entsprechenden Messvorgangs in Kontakt stehen. Das wesentliche Merkmal der Erfindung, nämlich, dass **alle** Leiterplattentestpunkte des ersten bzw. zweiten Prüfbereichs während des Messvorgangs mit der Kontaktanordnung in Kontakt stehen, ist somit in Anspruch 1 nicht unbedingt definiert.

Folglich ergibt sich, dass nicht notwendigerweise alle Leiterbahnen bzw. die Leiterbahnabschnitte, die sich vollständig in dem ersten bzw. zweiten Bereich befinden, getestet werden können. Deshalb kann das in der Beschreibung angegebene Ziel der Erfindung nicht erreicht werden. Infolgedessen stimmt der Anspruch 1 mit der Beschreibung nicht überein, so dass er von der Beschreibung nicht gestützt wird (Artikel 84 EPÜ 1973).

- 3.4 Der Beschwerdeführer argumentierte, es sei dem Fachmann klar, dass bei einem Paralleltester alle Kontaktstellen einer zu prüfenden Leiterplatte gleichzeitig kontaktiert würden. Mit dieser Kenntnis sei das Verfahren gemäß Anspruch 1 nur so zu verstehen, dass **alle** Leiterplattentestpunkte des ersten bzw. zweiten zu testenden Bereichs mit den Testkontakten des entsprechenden Bereichs der Kontaktanordnung in Kontakt stünden. Eine andere Interpretation würde für den Fachmann nicht in Frage kommen, da bei einem Paralleltester die vollkommene Kontaktierung der Testpunkte geläufig sei.

Aus folgenden Gründen kann sich die Kammer dieser Ansicht nicht anschließen. Es ist ersichtlich, dass eine vollständige und korrekte Ausführung eines Tests nur erfolgen kann, wenn alle Testpunkte, die in einen Messvorgang wirklich getestet werden (d.h. die Testpunkte des tatsächlichen zu testenden Prüfbereichs), während des Tests eine 100%ige Übereinstimmung mit den Kontakten der Kontaktanordnung aufweisen müssen. Diese perfekte Übereinstimmung innerhalb des zu testenden Bereichs ist nämlich eine Grundvoraussetzung eines Paralleltesters.

Wie bereits oben dargelegt, stellt die Kammer jedoch fest, dass eine 100%ige Übereinstimmung innerhalb des in Anspruch 1 erwähnten "Bereichs" nicht definiert ist. Insbesondere steht in Anspruch 1 lediglich, dass die zu testende Leiterplatte auf die Kontaktanordnung so aufgelegt wird, dass zumindest Leiterplattentestpunkte eines ersten Bereichs der Leiterplatte mit Testkontakten eines ersten Bereichs der Kontaktanordnung in Kontakt stehen. Dass (einige) Leiterplattentestpunkte eines ersten Bereichs während des Messvorgangs kontaktierbar sind, bedeutet nicht, dass der erste Bereich **nur** solche Testpunkte enthält. Der Wortlaut des Anspruchs 1 schließt somit nicht aus, dass der erste Bereich auch weitere, nicht kontaktierbare Punkte beinhalten kann.

Die Kammer ist sich dessen bewusst, dass der Fachmann bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen sollte. So ist davon auszugehen, dass der tatsächliche **Prüfbereich** eine 100%ige Übereinstimmung mit dem entsprechenden Bereich der Kontaktanordnung aufweisen muss. Auf Seite 12, Zeilen 11 bis 13 der Beschreibung wird nämlich erklärt, dass die Justiereinrichtung derart betätigt wird, dass die Leiterplatte **mit dem Prüfbereich exakt auf den Testkontakten des korrespondierenden Bereichs des Adapters ausgerichtet wird**. Jedoch ist der Begriff "Bereich" in Anspruch 1 nicht näher definiert und somit nicht auf den tatsächlichen Prüfbereich im obigen Sinne beschränkt. Insbesondere lässt der Wortlaut des Anspruchs 1 offen, ob es sich bei dem ersten Bereich bzw. dem zweiten Bereich um echte **Prüfbereiche** handelt, die **nur** kontaktierbare Punkte enthalten. Eine klare Aussage, dass **alle** Leiterplattentestpunkte des ersten bzw. zweiten Bereichs während des Messvorgangs kontaktierbar

sind, wie es in der Beschreibung zu finden ist, fehlt in Anspruch 1.

Zudem argumentierte der Beschwerdeführer bezüglich der Definition der Bereiche, dass Anspruch 1 einen ersten und einen zweiten Bereich definiere, wobei die zu testende Leiterplatte derart auf der Kontaktanordnung ausgerichtet werde, dass zunächst die Leiterplattentestpunkte des ersten Bereichs und dann die Leiterplattentestpunkte des zweiten Bereichs mit den Testkontakten der Kontaktanordnung in Kontakt stünden. Diese Angabe drücke klar aus, dass **die** (d.h. **alle**) Leiterplattentestpunkte des jeweiligen Bereichs während des entsprechenden Testmessvorgangs kontaktiert würden.

Jedoch ist die Kammer der Meinung, dass eine solche klare Aussage in Anspruch 1 fehlt. Es ist durchaus möglich, den Begriff "Bereich" gemäß Anspruch 1 anders als den "Prüfbereich" in der Beschreibung auszulegen, so dass er sowohl die kontaktierbaren Testpunkte des Prüfbereichs als auch nicht-kontaktierbare Testpunkte beinhaltet.

- 3.5 Zusammenfassend ist aus der Beschreibung klar, dass es ein wesentliches Merkmal der Erfindung ist, dass **alle** Testpunkte des zu testenden Bereichs während des entsprechenden Testmessvorgangs mit der Kontaktanordnung in Kontakt stehen. Insofern als der Wortlaut des Anspruchs 1 dieses Merkmal nicht eindeutig ausdrückt, stimmt der Anspruch 1 mit der Beschreibung nicht überein. Das in der Beschreibung angegebene Ziel der Erfindung ist somit nicht zu erreichen. Folglich wird der Anspruch 1 von der Beschreibung nicht gestützt (Artikel 84 EPÜ 1973).

4. **Hilfsantrag 1:**

Bezüglich der in Anspruch 1 eingeführten Merkmale wies der Beschwerdeführer darauf hin, dass nun angegeben sei, dass nach dem Festlegen von überlappenden Bereichen und dem Auflegen der Leiterplatte auf die Kontaktanordnung zumindest die Leiterplattentestpunkte eines ersten bzw. zweiten Bereichs mit den Testkontakten des entsprechenden Bereichs der Kontaktanordnung fehlerfrei in Kontakt stünden.

Nach Ansicht der Kammer dienen die in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags vorgenommenen Änderungen jedoch nicht dazu, den gegen den Hauptantrag erhobenen Einwand auszuräumen. Es fehlt nach wie vor eine eindeutige Aussage, dass wirklich **alle** Leiterplattentestpunkte eines ersten bzw. zweiten Bereichs mit den entsprechenden Kontakten der Kontaktanordnung in Kontakt stehen. Wie auch bei dem Hauptantrag, schließt der Wortlaut des Anspruchs 1 nicht aus, dass der erste Bereich möglicherweise aus zwei Unterbereichen bestehen kann, und zwar aus einem tatsächlichen Prüfbereich, bei welchem alle Testpunkte während des ersten Messvorgangs fehlerfrei kontaktierbar sind, und aus einer weiteren Region, bei welcher die Testpunkte während des ersten Messvorgangs nicht kontaktierbar sind.

Die Kammer kann sich der Meinung des Beschwerdeführers nicht anschließen, dass das ergänzende Merkmal, dass der Verschiebevorgang und der Testmessvorgang wiederholt würden, bis die Leiterplatte "in allen Bereichen" getestet sei, klar ausdrücke, dass alle Leiterplattentestpunkte kontaktiert und alle

Leiterbahnen getestet werden müssten. Dieses Merkmal definiert lediglich, dass die Leiterplatte in allen Bereichen (wobei, wie oben dargelegt, diese Bereiche nicht unbedingt die tatsächlichen Prüfbereiche sein müssen) getestet wird, aber nicht dass jeder Bereich **vollständig** getestet wird.

Somit gilt auch für den ersten Hilfsantrag der gleiche Einwand, der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhoben wurde, nämlich, dass der Anspruch 1 mit der Beschreibung nicht übereinstimmt und folglich von ihr nicht gestützt wird (Artikel 84 EPÜ 1973).

5. **Hilfsanträge 2 und 3:**

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags im wesentlichen durch das Ermitteln der Abweichungen der Testpunkte von ihren Soll-Positionen und das Optimieren der Bereiche der zu testenden Leiterplatte auf Grundlage der ermittelten Abweichungen und auf Grundlage von Leiterplattendaten dahingehend, dass möglichst viele Leiterbahnen und/oder möglichst viele Leiterplattentestpunkte mit der Kontaktanordnung in Kontakt stehen.

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags dadurch, dass die Testkontakte exakt in dem Muster der Leiterplattentestpunkte einer idealen zu testenden Leiterplatte angeordnet sind.

Bezüglich des dritten Hilfsantrags, führte der Beschwerdeführer aus, dass es mit dem hinzugefügten

Merkmal nun eindeutig sei, dass für jeden Leiterplattentestpunkt ein Testkontakt in der Kontaktanordnung vorgesehen sei, so dass bei einer korrekten Ausrichtung eines Bereiches der Leiterplatte alle Leiterplattentestpunkte dieses Bereiches korrekt mit den entsprechenden Testkontakten der Kontaktanordnung in Kontakt stünden.

Nach Ansicht der Kammer dienen die vorgenommenen Änderungen gemäß dem zweiten und dem dritten Hilfsantrag nicht dazu, den unter Punkt 4 vorgebrachten Einwand auszuräumen. Aus dem jeweiligen Anspruch 1 dieser zwei Anträge geht nach wie vor nicht eindeutig hervor, dass die Bereiche derart definiert sind, dass alle dazugehörigen Leiterplattentestpunkte während des entsprechenden Testvorgangs kontaktiert werden.

Somit gilt immer noch der Einwand, dass der Anspruch 1 mit der Beschreibung nicht übereinstimmt. Folglich wird dass der Anspruch 1 von der Beschreibung nicht gestützt (Artikel 84 EPÜ 1973).

6. **Hilfsantrag 4:**

Die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 vorgenommenen Änderungen stellen einen Versuch dar, klarzustellen, dass alle Punkte eines Bereichs während des Testmessvorgangs kontaktiert werden.

Dieser Versuch ist jedoch misslungen. Das neu eingefügte Merkmal definiert nur, dass **die in den überlappenden Abschnitten zweier Bereiche angeordneten Testpunkte** kontaktiert werden und lässt somit offen, ob die

weiteren Testpunkte des jeweiligen Bereichs während des Messvorgangs kontaktiert werden.

Somit gilt nach wie vor der Einwand, dass der Anspruch 1 mit der Beschreibung nicht übereinstimmt. Folglich wird der Anspruch 1 von der Beschreibung nicht gestützt (Artikel 84 EPÜ 1973).

7. Rechtliches Gehör:

Nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Selbst eine Entscheidung, die nach einem Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akte ergeht, unterliegt dieser Pflicht.

In dem Bescheid vom 09. Januar 2009 wurde ein Einwand unter Artikel 84 EPÜ 1973 in Bezug auf das Fehlen wesentlicher Merkmale in den Ansprüchen und das Nichterreichen des in der Beschreibung angegebenen Zieles erhoben. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit des Vertreters des Beschwerdeführers wurde dieser Einwand im Lichte der geänderten Ansprüche diskutiert.

Der Beschwerdeführer blieb trotz ordnungsgemäßer Ladung zur mündlichen Verhandlung fern und hatte deshalb keine Gelegenheit, sich zu den weiterentwickelten Argumenten zu äußern. Trotzdem sind die Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPÜ 1973 erfüllt, denn es handelt sich hier lediglich um eine Untermauerung der bereits vorgebrachten Tatsachen und Rechtsgründe und nicht um ein neues Vorbringen als solches. Die Erörterung der Frage, ob die neu eingereichten Ansprüche den erhobenen

Einwand beheben, war für den abwesenden Beschwerdeführer nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten.

Aus diesen Überlegungen heraus ist die Kammer der Auffassung, dass die vorliegende Entscheidung bei dieser Sachlage trotz des Fernbleibens des Beschwerdeführers von der mündlichen Verhandlung nicht den Grundsatz der Wahrung des in Artikel 113 (1) EPÜ 1973 verankerten rechtlichen Gehörs verletzt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

R. Schumacher

G. Assi